

日本顕微鏡学会 「SEM の物理学」分科会 講演会

テーマ：表面分析ツールとしての走査電子顕微鏡

日時：平成 26 年 12 月 8 日(月) 13:30~17:00

場所：大阪工業大学 うめきたナレッジセンター

(〒530-0011 大阪市北区大深町 3 番 1 号

グランフロント大阪 ナレッジキャピタル タワー C 9 階)

参加費：1,000 円

協賛：応用物理学会関西支部、表面分析研究会

趣旨：近年の走査電子顕微鏡 (SEM) では装置の高性能化により、材料から様々な表面情報を引き出すことが可能になって来た。本講演会では、最近の SEM による観察・分析事例についての講演を基に、表面分析ツールとしての観点から SEM 像コントラストについて議論をしたい。

- プログラム -

- 13:30~14:20 SiC 結晶表面積層配向を反映した SEM コントラスト発現機構
(関西学院大学 芦田 晃嗣, 金子 忠昭)
- 14:20~15:10 スピン偏極走査電子顕微鏡 (日立製作所中央研究所 孝橋 照生)
- 15:10~15:30 休憩
- 15:30~16:10 EBSD パターンを形成する反射電子の持つ情報について
(TSL ソリューションズ 鈴木 清一)
- 16:10~16:40 国際顕微鏡学会議 2014 (IMC2014) SEM 関連報告
(日立ハイテクサイエンス 田中 啓一)
- 16:40~17:00 総合討論

申込み方法：氏名、勤務先、所属、住所、電話番号、E-mail アドレス、
顕微鏡学会会員・非会員の別をご記入の上、
E-mail にて次の代表世話人までお申込み下さい。
会場の都合により先着 70 名で締め切らせて頂きます。

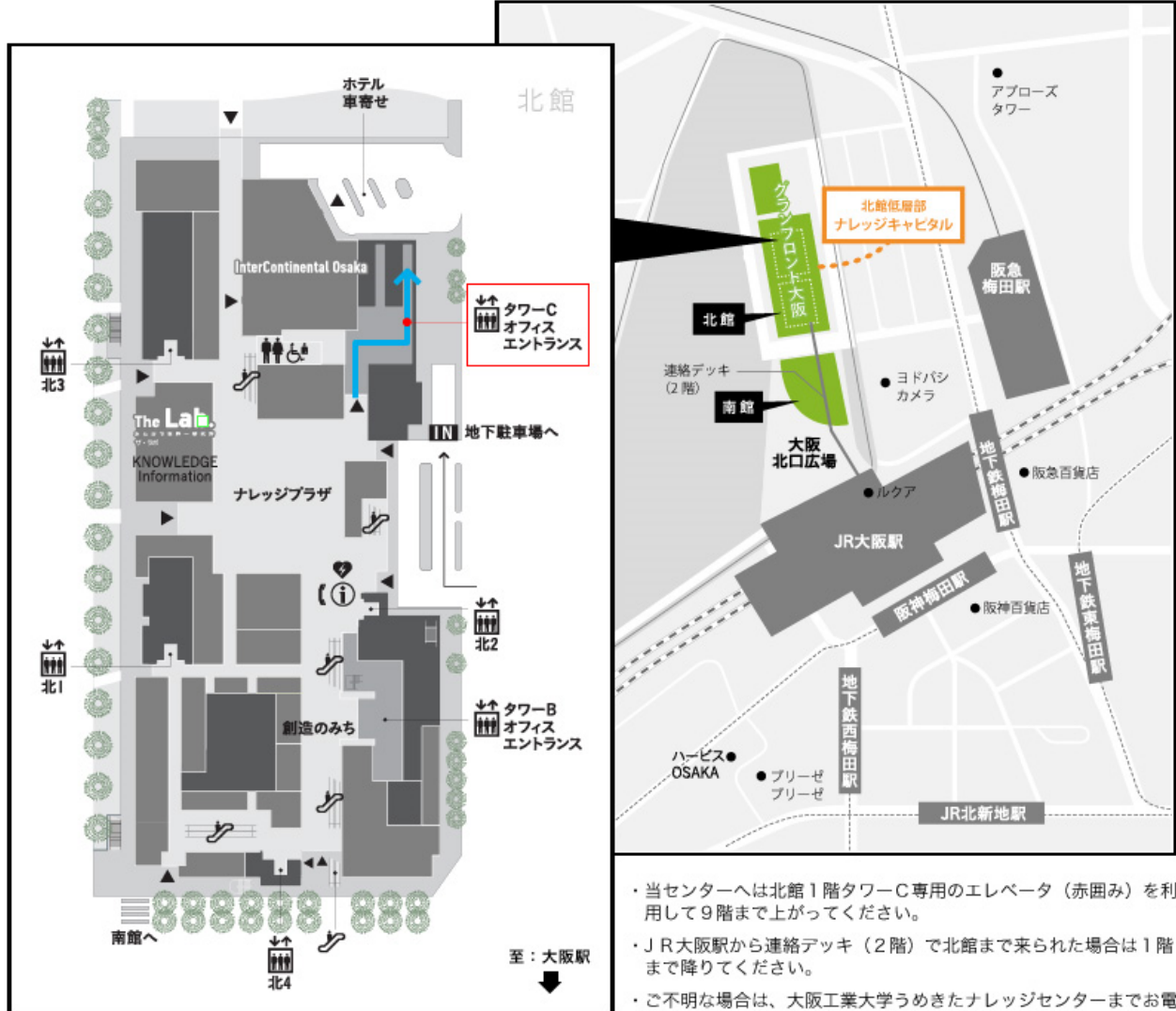
代表世話人：大阪府立大学大学院 工学研究科 安田 雅昭
(Tel:072-254-9270, E-mail:yasuda@pe.osakafu-u.ac.jp)

<会場アクセス>

次ページのアクセスマップもしくは次のホームページを参照下さい。

<http://www.oit.ac.jp/umekita/#Access>

アクセスマップ



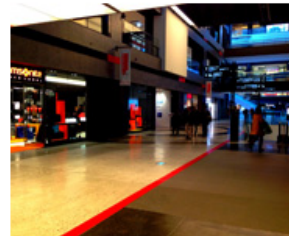
- ・当センターへは北館1階タワーC専用のエレベータ（赤囲み）を利用して9階まで上がってください。
- ・JR大阪駅から連絡デッキ（2階）で北館まで来られた場合は1階まで降りてください。
- ・ご不明な場合は、大阪工業大学うめきたナレッジセンターまでお電話ください。(06-6359-1159)

JR大阪駅からのアクセス



ルート①

JR大阪駅2階よりグランフロント大阪の方に進み、南館を通り抜けて連絡橋を渡ります。



ルート②

北館に入って、Samsoniteの前にエスカレーターがありますので、そちらで1階まで下ります。



ルート③

北館1階にある広場に出て右手 TULLY'S COFFEE 正面には Armani Exchange があり、その奥にある自動扉を進むと、そちらが北館1階タワーCです。



ルート④

ナレッジオフィス専用エレベーターBで9階までおこし下さい。